

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2006 年 11 月 30 日 (30.11.2006)

PCT

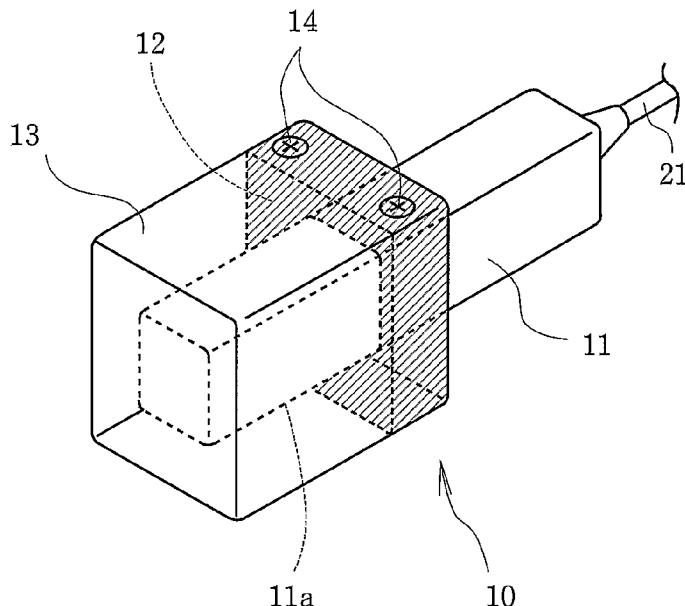
(10) 国際公開番号
WO 2006/126285 A1

- (51) 国際特許分類:
G01R 29/24 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/011195
- (22) 国際出願日: 2005 年 6 月 13 日 (13.06.2005)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2005-155348 2005 年 5 月 27 日 (27.05.2005) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ヒューグルエレクトロニクス株式会社 (HUGLE ELECTRONICS INC.) [JP/JP]; 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4丁目5番7号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中島用松 (NAKAJIMA, Yomatsu) [JP/JP]; 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4丁目5番7号 ヒューグルエレクトロニクス株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 森田 雄一 (MORITA, Yuichi); 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目7番1号 ニュー九段ビル6階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA,

/ 続葉有 /

(54) Title: ION CONTROL SENSOR

(54) 発明の名称: イオンコントロールセンサ



(57) Abstract: A neutralizer for neutralizing an article to be neutralized by supplying positive and negative ions comprising a probe for measuring the surface potential of the article. The neutralizer further comprises a potential detecting section (11a) constituting the surface potential measuring probe (11), and a conductive cap (13) arranged to surround the potential detecting section (11a) under noncontact state. The potential detecting section (11a) detects a potential generated in the cap (13) by charges on the article (30) to be neutralized or ions supplied from the neutralizer (20) and delivers it as a feedback signal to a control circuit (24) in the neutralizer (20). Ion balance and charge potential of an article to be neutralized can be detected through an extremely simple structure to thereby contribute to enhancement of neutralization performance of the ionizer.

(57) 要約: 被除電物に正負のイオンを供給して除電する除電装置であって、被除電物の表面電位を測定するための表面電位測定用プローブを備えた除電装置において、

/ 続葉有 /

WO 2006/126285 A1



SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

規則4.17に規定する申立て:

- 出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する申立て (規則4.17(ii))
- 発明者である旨の申立て (規則 4.17(iv))

表面電位測定用プローブ(11)を構成する電位検出部(11a)と、この電位検出部(11a)に対し非接触状態で包囲するように配置された導電性のキャップ(13)とを備え、被除電物(30)の帯電電荷または除電装置(20)から供給されたイオンによってキャップ(13)に発生した電位を、電位検出部(11a)により検出してフィードバック信号として除電装置(20)内の制御回路(24)に送出する。本発明によれば、極めて簡単な構造により、イオンバランスの検出や被除電物の帯電電位の検出を可能にしてイオナイザの除電性能の向上に寄与することができる。